



Diszlokációtávának Zn egykristályokban: földrengések a mikronos skálán

Ispánovity Péter Dusán

ELTE TTK Budapest,
Anyagfizikai Tsz.

Közreműködők

ELTE TTK, Anyagfizikai Tanszék

Ispánovity Péter Dusán, Ugi Dávid,
Péterffy Gábor, Dankházi Zoltán,
Tüzes Dániel, Vida Ádám, Groma István



EMPA Thun, Svájc
Laboratory for Mechanics of Materials
& Nanostructures

Kalácska Szilvia

Károly Egyetem Prága,
Dept. of Materials Physics

Michal Knapek, Máthis Krisztián,
Frantisek Chmelík



Vázlatos felépítés

Földrengések

Empirikus törvények

Kísérleti összeállítás

Mikrooszlopok kialakítása

Mikrooszlopok deformációja

AE mérések

Mi köze a mikrooszlopoknak a földrengésekhez?

Háttér

Mikromechanika

Deformációs lavinák

Akusztikus emisszió (AE)

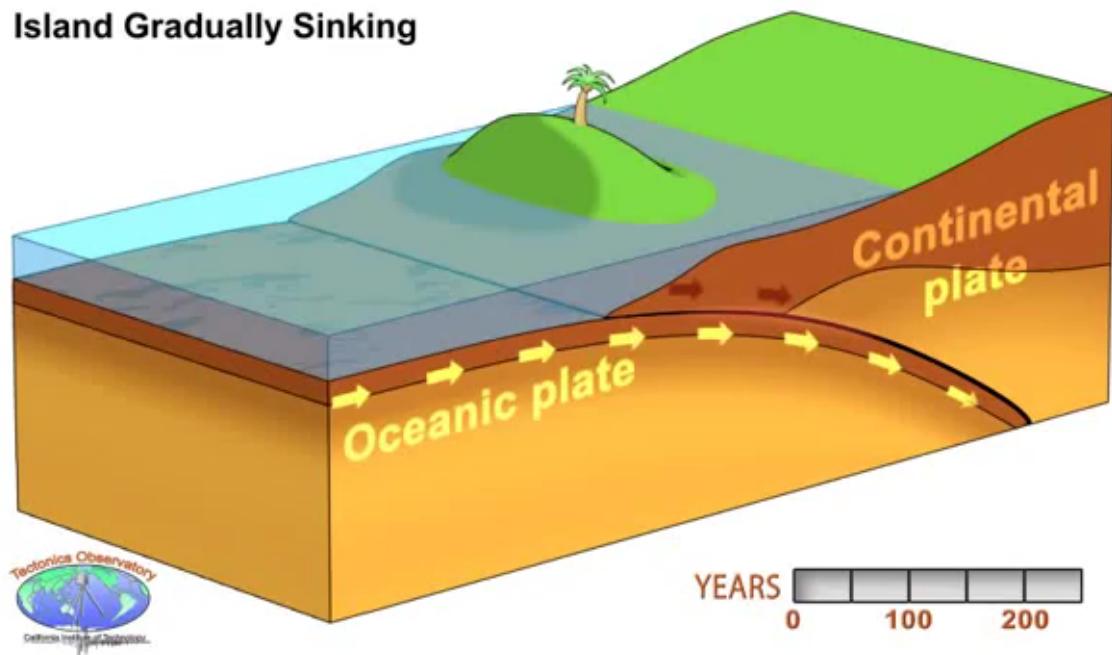
Mérési eredmények

Feszültség-deformációs görbe

AE jelek analízise

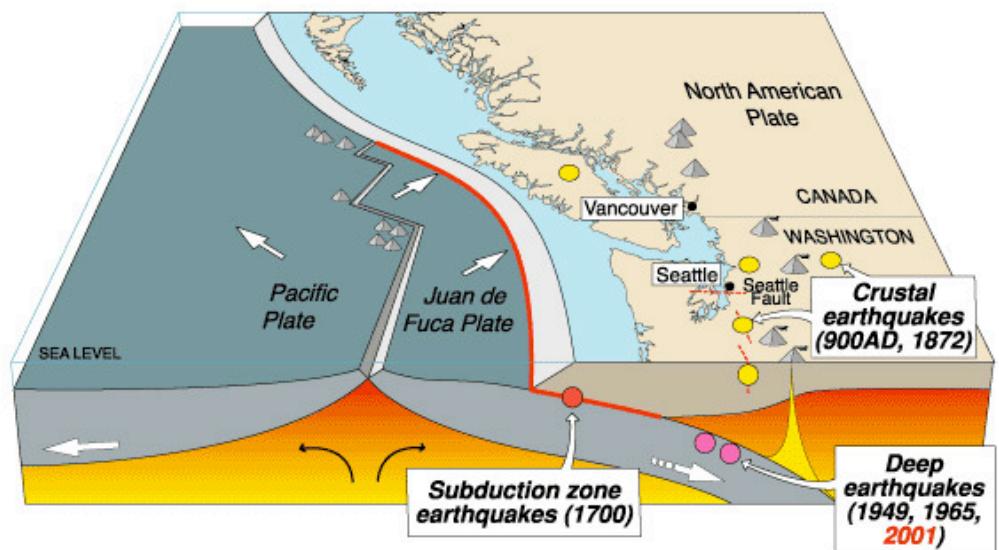
Mi a földrengés?

- A földrengés előtt belső rugalmás erők épülnek fel
- Maradandó alakváltozás során felszabadul a rugalmás energia
- Rugalmas hullámok formájában távozik



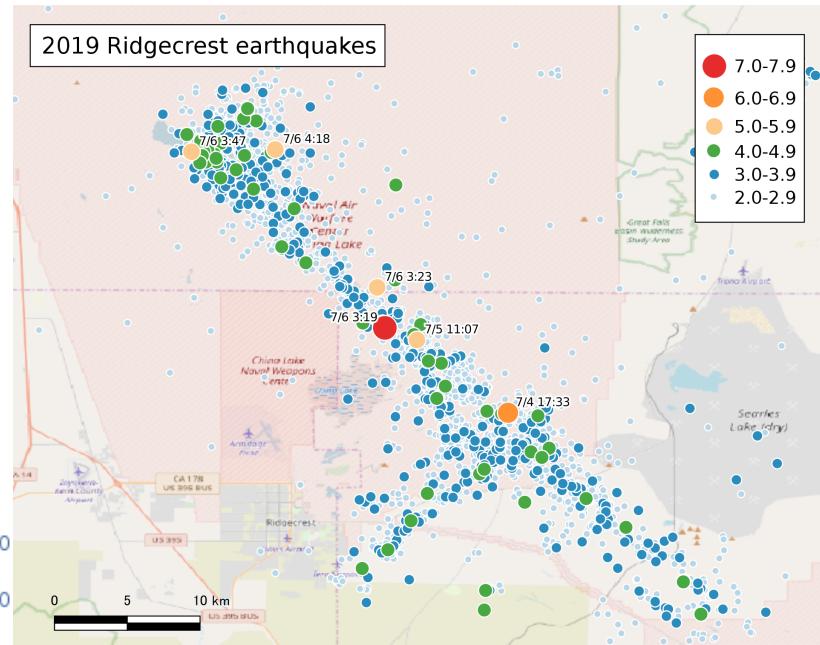
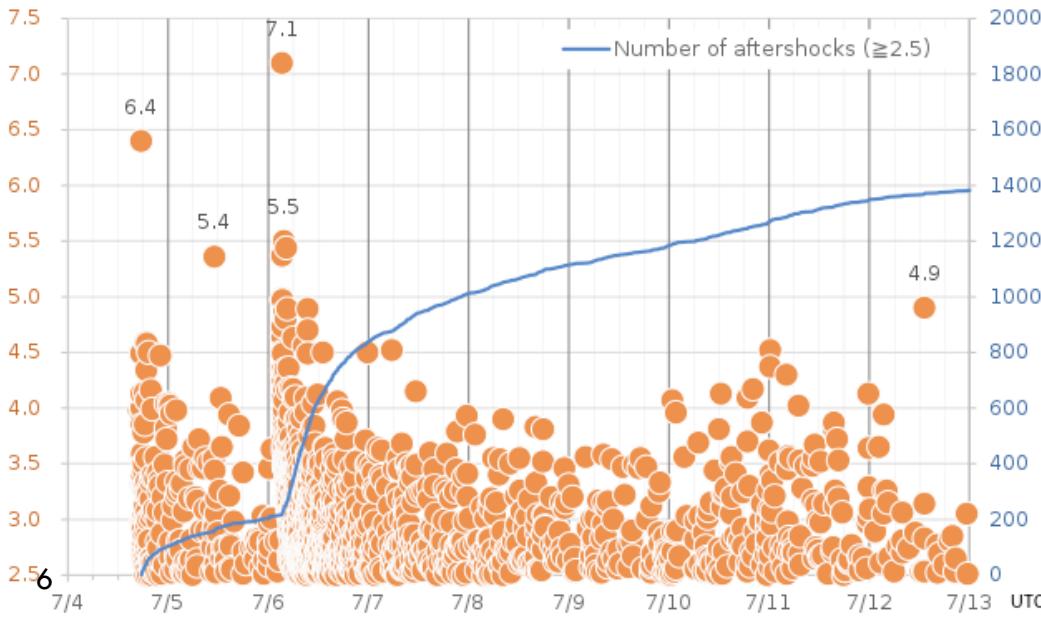
A 2019. évi Ridgecrest földrengés

- 2019. július 4-5.
- Richter skála szerinti 7,1-es földrengés
- Az elmúlt 20 év legerősebb földrengése Kaliforniában
- Los Angeles-től 200 km-re
- Mély földrengés: 10 km-rel a felszín alatt



Utórengések

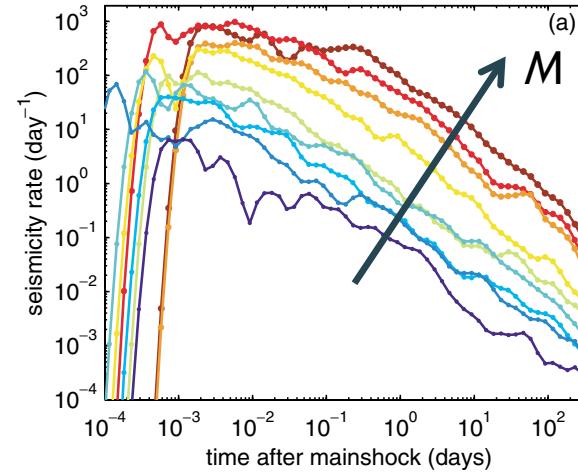
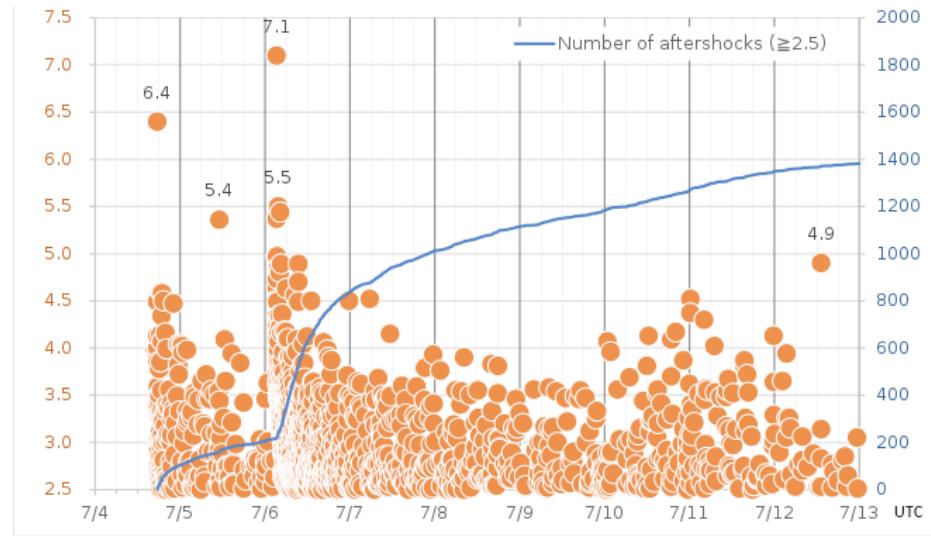
- Utórengések száma:
 - 3 nap alatt kb. 4000
 - 6 hónap alatt kb. 40000
- Térbeli kiterjedés:
 - 50 km-es hosszon voltak utórengések
 - az elmozdulás mértéke kb. 20 cm



- Utórengések rátája $n(t)$
 - n : egységnyi idő alatti utórengések száma
 - t : főrengés óta eltelt idő
- Omori-törvény: $n(t) \sim 1/t$

Fundamentális empirikus törvények

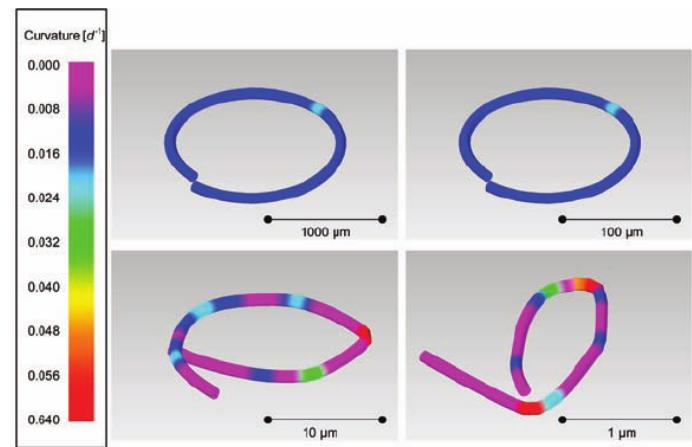
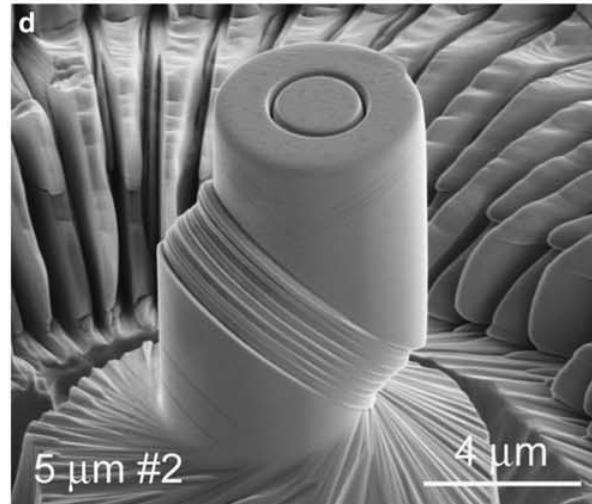
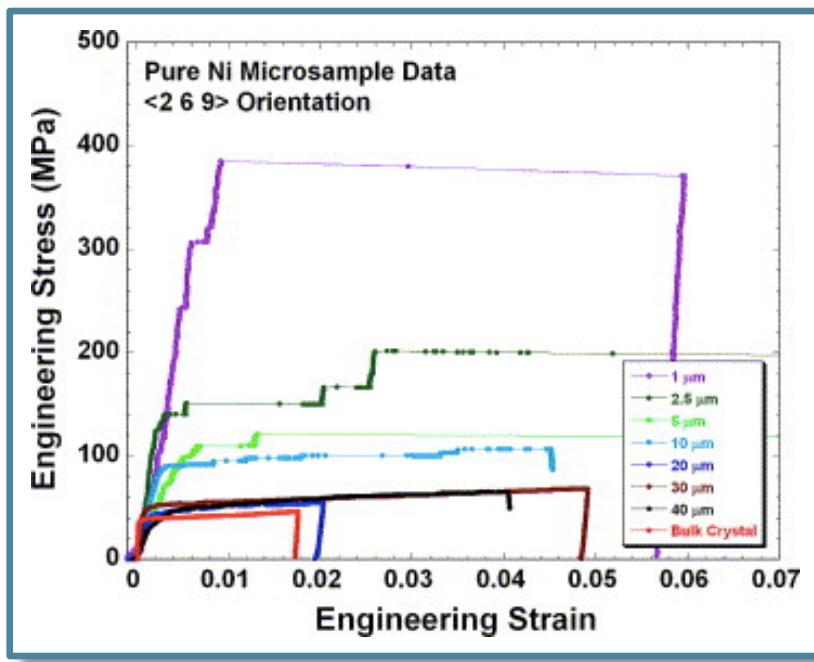
- Gutenberg-Richter-törvény:
 - $P(E) \propto E^{-\tau}$
 - Exponens $\sim 1,6$
- Produktivitási törvény
 - $n(t) \propto E_{\text{ms}}^\beta$
 - E_{ms} a főrengés energiája
 - Exponens $\sim 0,5$



Helmstetter, PRL, 2003

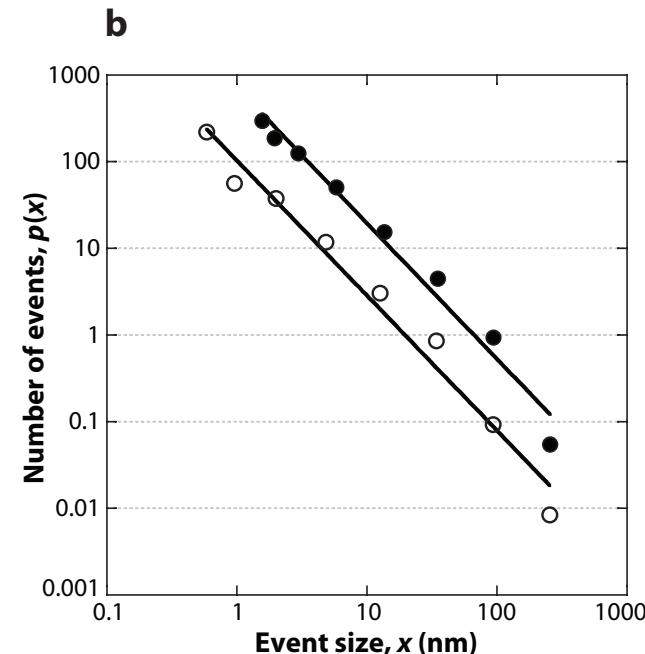
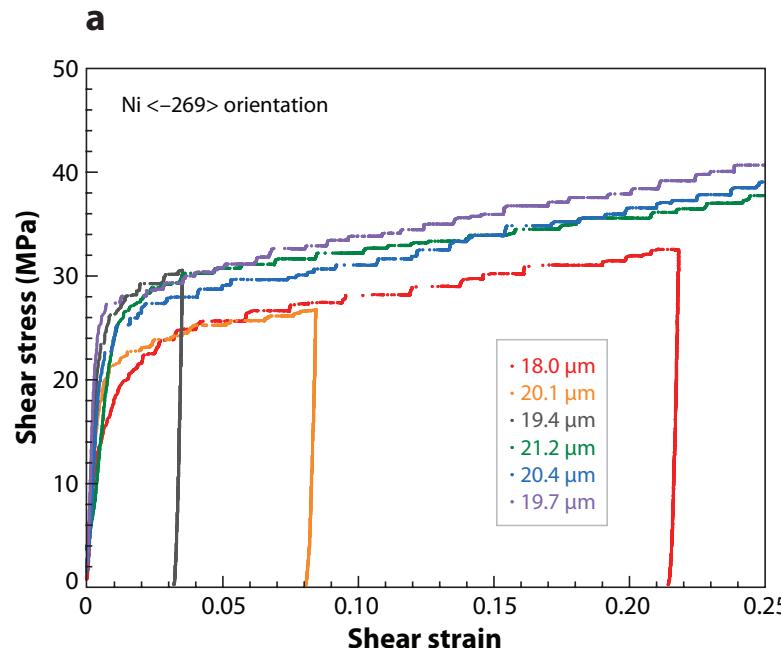
Kristályplaszticitás a mikronos skálán

- Mikron méretű minták (mikrooszlopok)
 - Méreteffektusok
 - Nagy, véletlenszerű deformációs ugrások
 - Megjósolhatatlan deformáció



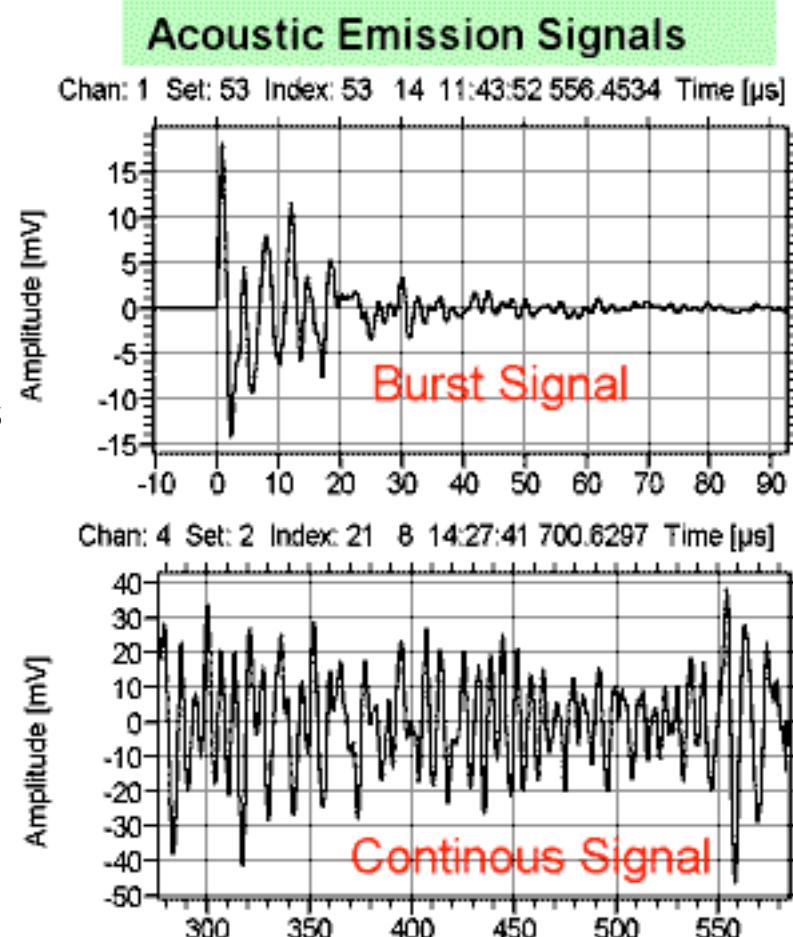
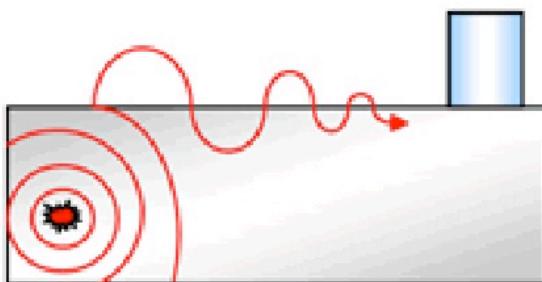
Deformációs/diszlokáció lavinák

- Véletlen deformációs ugrások
- Hatványfüggvény szerinti eloszlás: $P(s) = As^{-\tau} e^{-\frac{s}{s_0}}$
 - τ : lava-exponens ($\approx 1,5$)
 - s_0 : levágás (cutoff) (≈ 100 nm)
- Ok: diszlokációk kollektív, lava-szerű mozgása



Akusztikus emisszió (AE) mérése

- Akusztikus jelek detektálása a minta felszínén piezoelektronos detektorral
- A detektált jel
 - jellemző a forrásra és a detektorra is
 - függ a forrás és a detektor távolságától
 - lehet folytonos vagy szaggatott

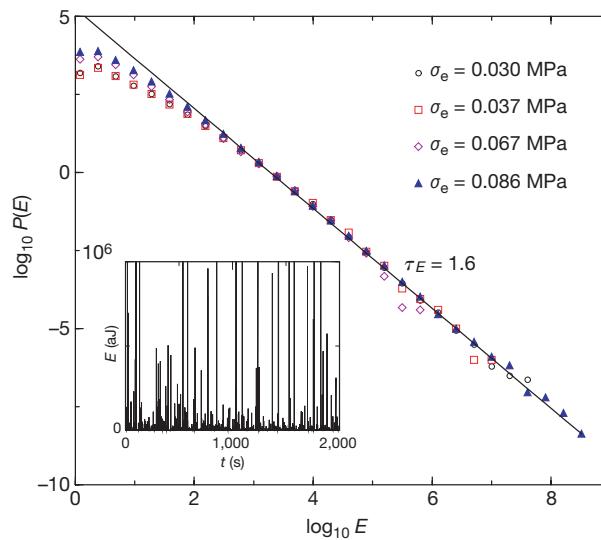
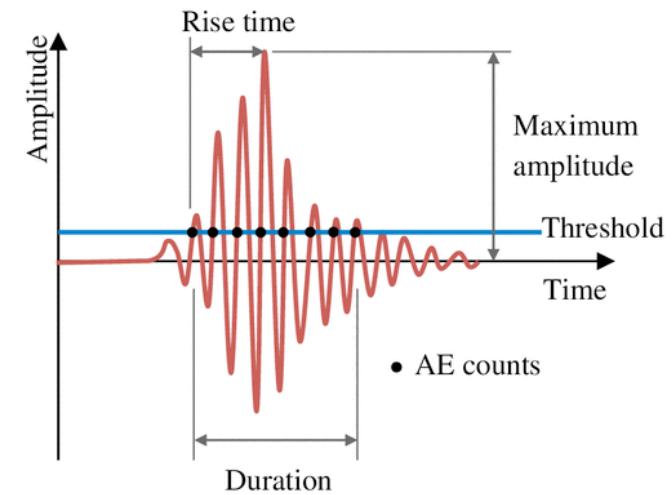


hcp egykristályok akusztikus emissziója

- AE jég, Cd és Zn mintákon
 - $P(E) \propto E^{-\tau_E}$
 - $\tau_E \approx 1,6$ (AE jel energiája)
 - $\tau_A \approx 2,0$ (AE jel amplitúdója)
 - Nincs levágás
 - Robosztus exponensek
 - Az események kiindulópontjai egy fraktált alkotnak
- Nyitott kérdés
 - Nem ismert, hogy az AE jelek milyen kapcsolatban vannak a lokális deformációval

Weiss et al., PRB (2007)

¹¹Weiss et al., Science (2003)



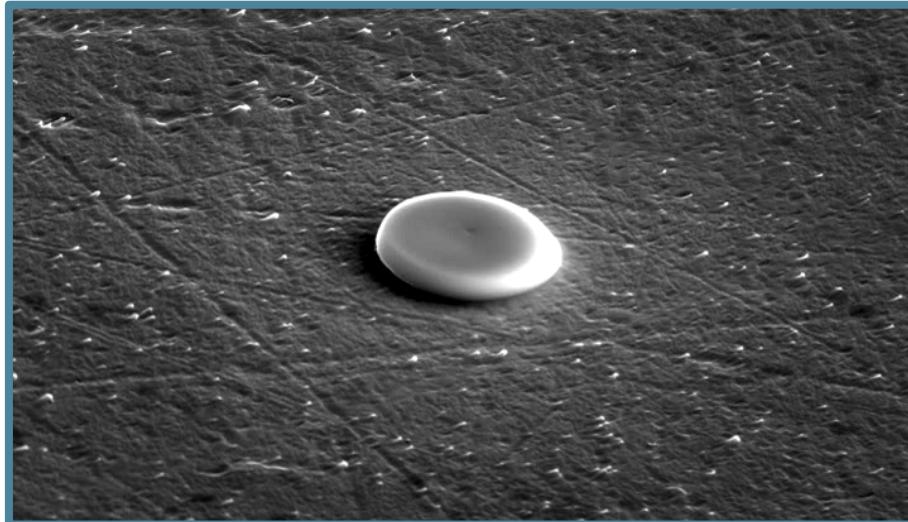
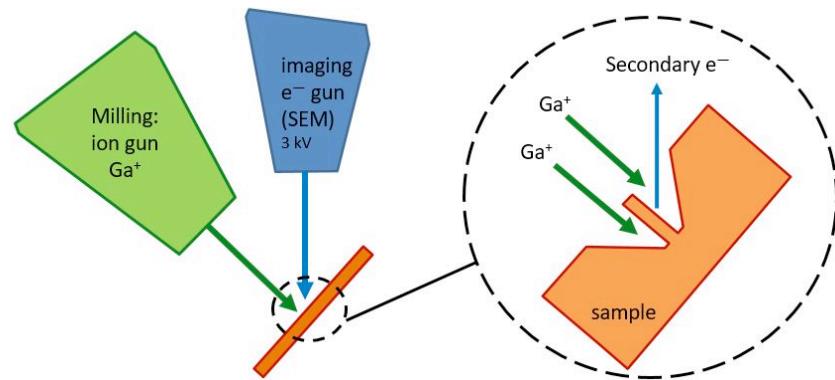
Miguel et al., Nature (2001)

Célkitűzés

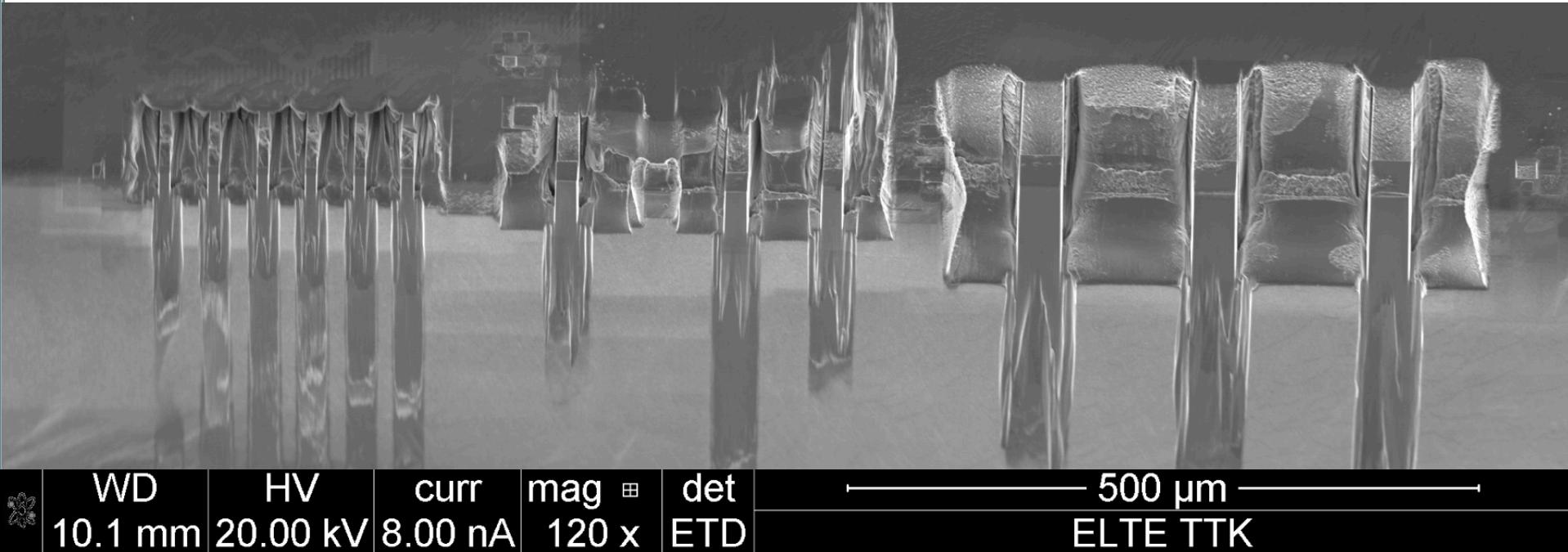
- Cél: összekapcsolni a mikrooszlop összenyomási és az AE kísérleteket
 - Bizonyítani az AE és a deformációs lavinák közti korrelációt
 - Értelmezni az AE jeleket a deformációs ugrások tulajdonságainak függvényében
 - Megérteni, hogy az AE jelek hogyan függenek a deformációs mechanizmustól

Mikrooszlop faragása

- 20keV-es fókuszált Ga^+ ionokkal bombázzuk a felületet
- Módszerek
 - Felülről lefelé ill. oldalról
 - Opcionális amorf Pt réteg



Zn mikrooszlopok



Minta:

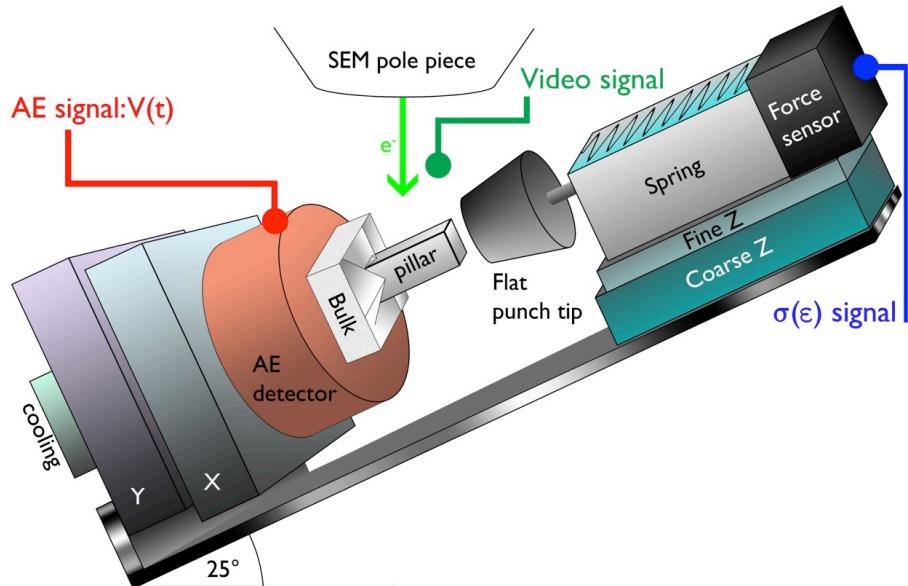
- Bazális síkra orientált Zn (hcp) egykristály
 - nincs keresztcsúszás ill. ikresedés
- Egyszeres csúszás a bazális síkon

Mikrooszlop:

- Átmérő 8-32 µm
- Négyzet keresztmetszet

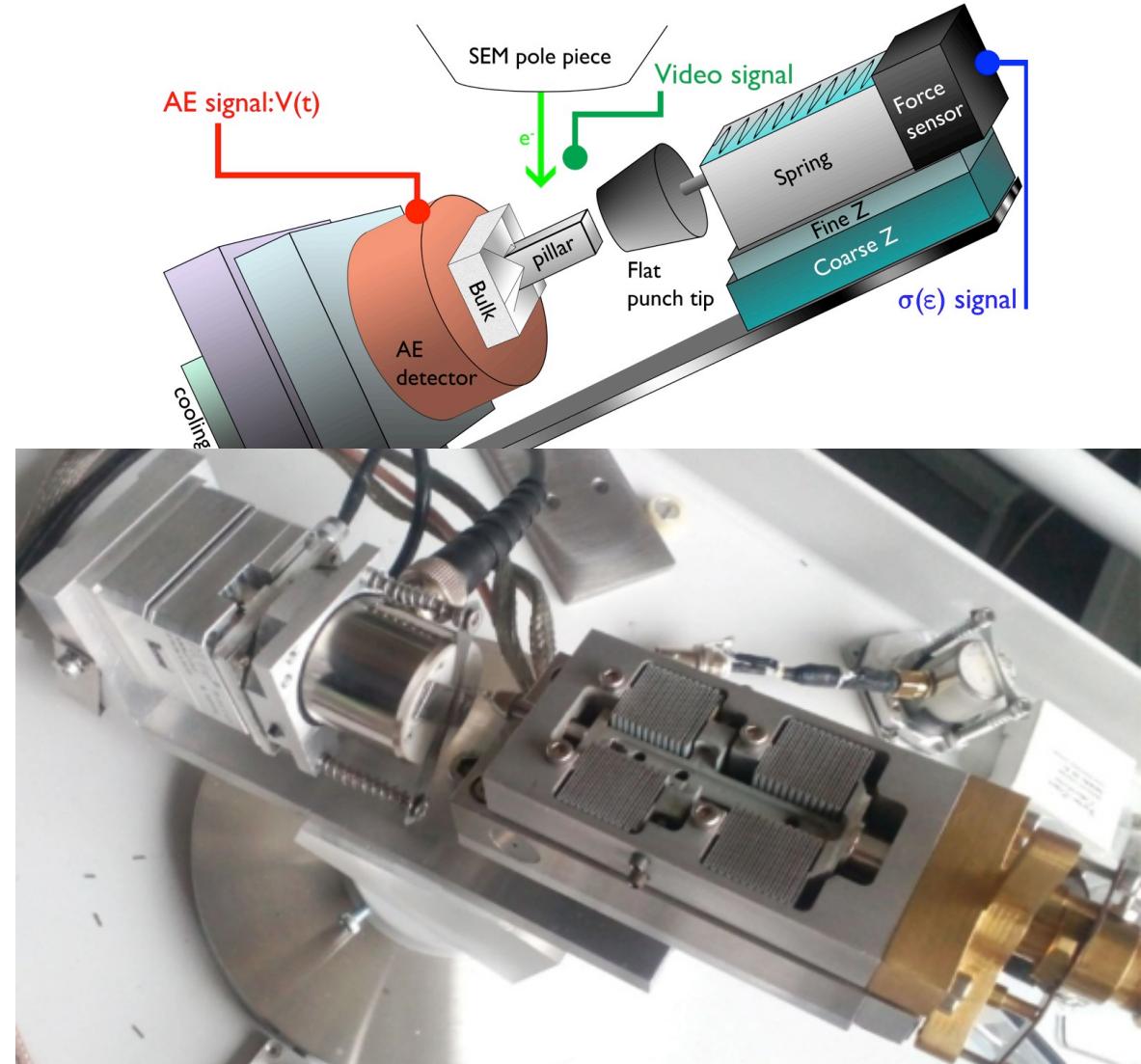
'Nanotest' in situ deformációs platform

- In situ deformáció a SEM vákuumkamrában
- Precízió
 - xy : 0.5 μm
 - z : 1 nm
 - erő: 1 μN
- Maximum 10 μm elmozdulás z irányban
- Változtatható rugóállandó (jelenleg 1 $\text{mN}/\mu\text{m}$ vagy 10 $\text{mN}/\mu\text{m}$)
- Mintavétel: 200 Hz



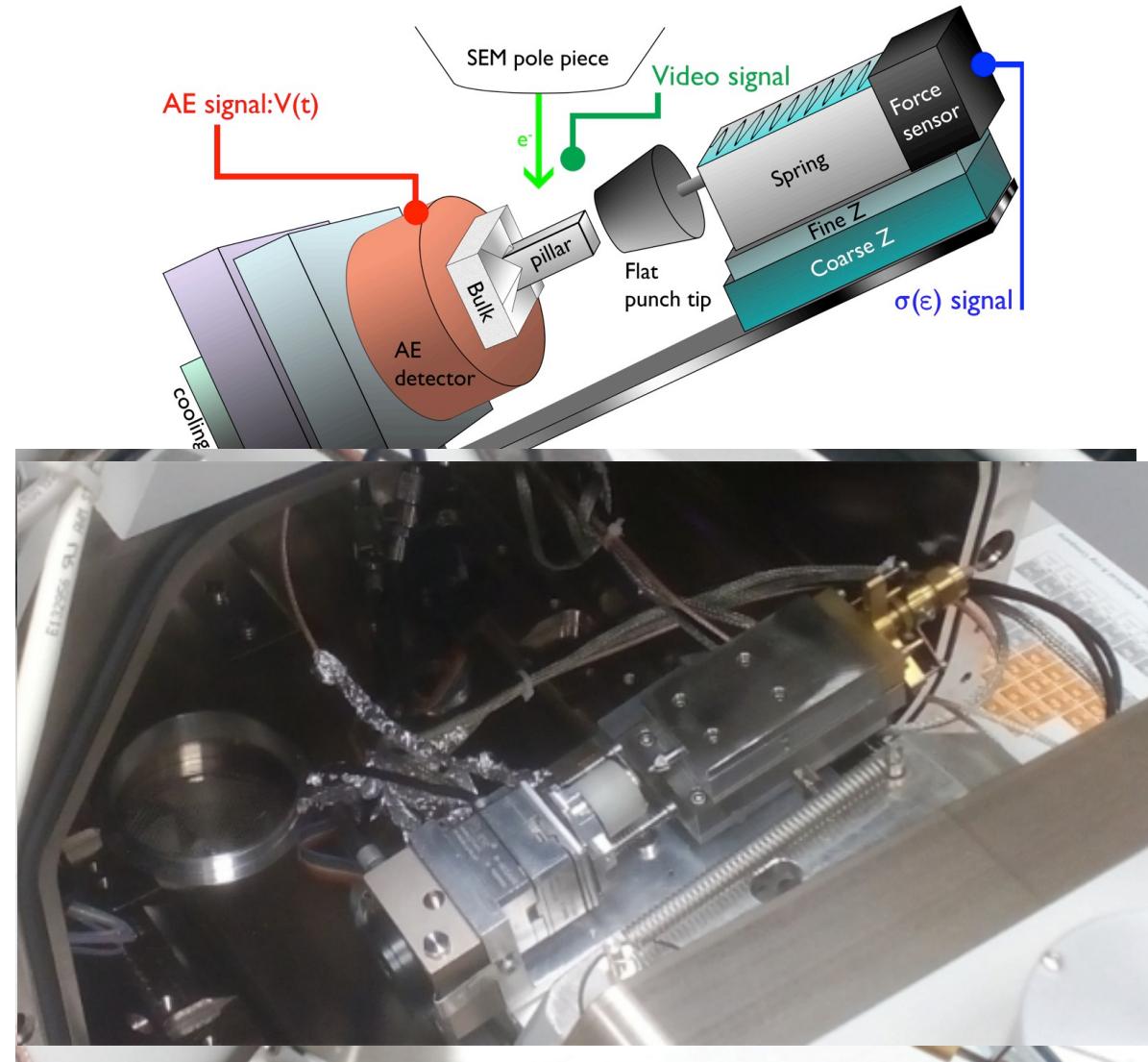
'Nanotest' in situ deformációs platform

- In situ deformáció a SEM vákuumkamrában
- Precízió
 - xy : 0.5 μm
 - z : 1 nm
 - erő: 1 μN
- Maximum 10 μm elmozdulás z irányban
- Változtatható rugóállandó (jelenleg 1 $\text{mN}/\mu\text{m}$ vagy 10 $\text{mN}/\mu\text{m}$)
- Mintavétel: 200 Hz

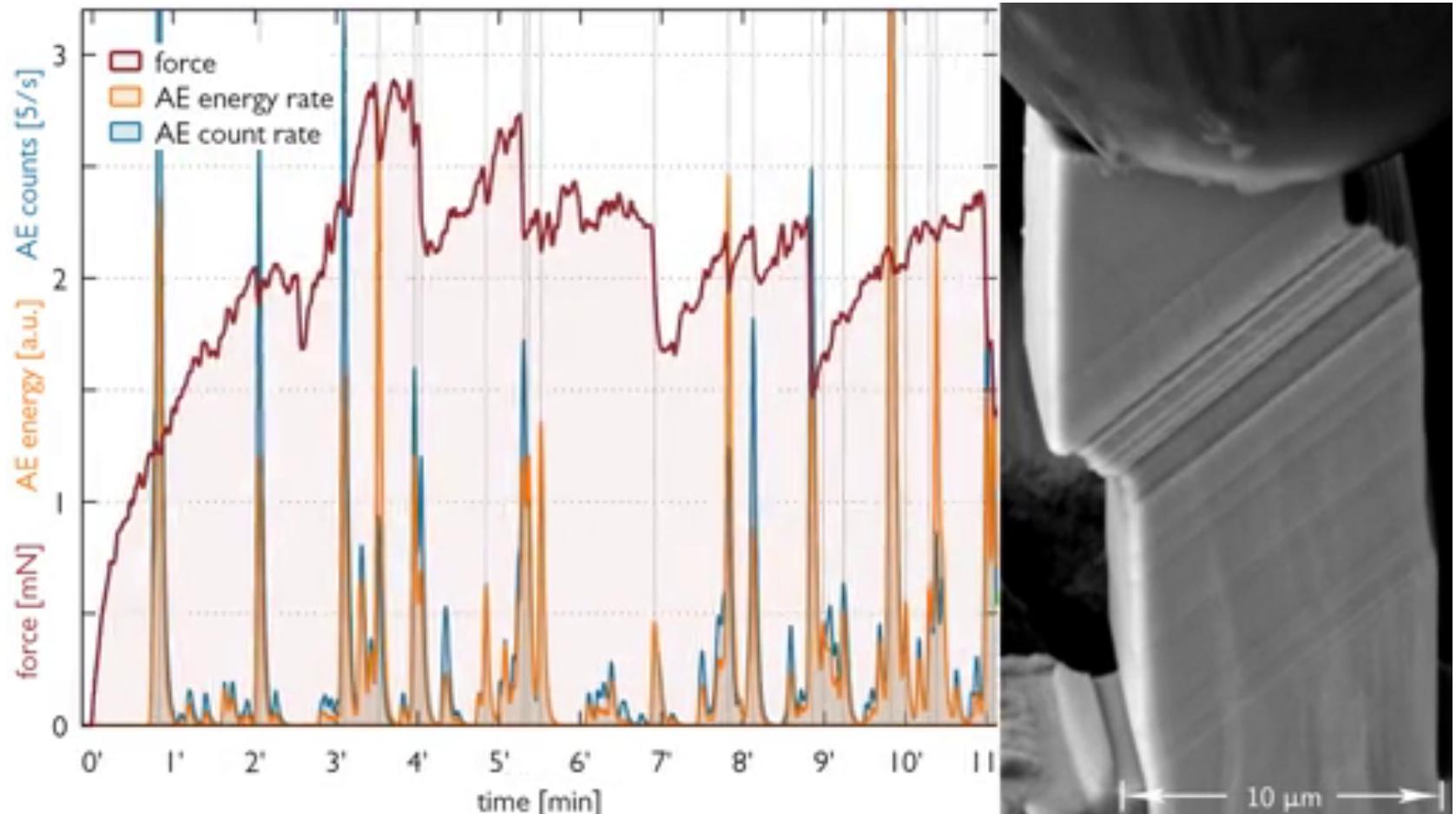


'Nanotest' in situ deformációs platform

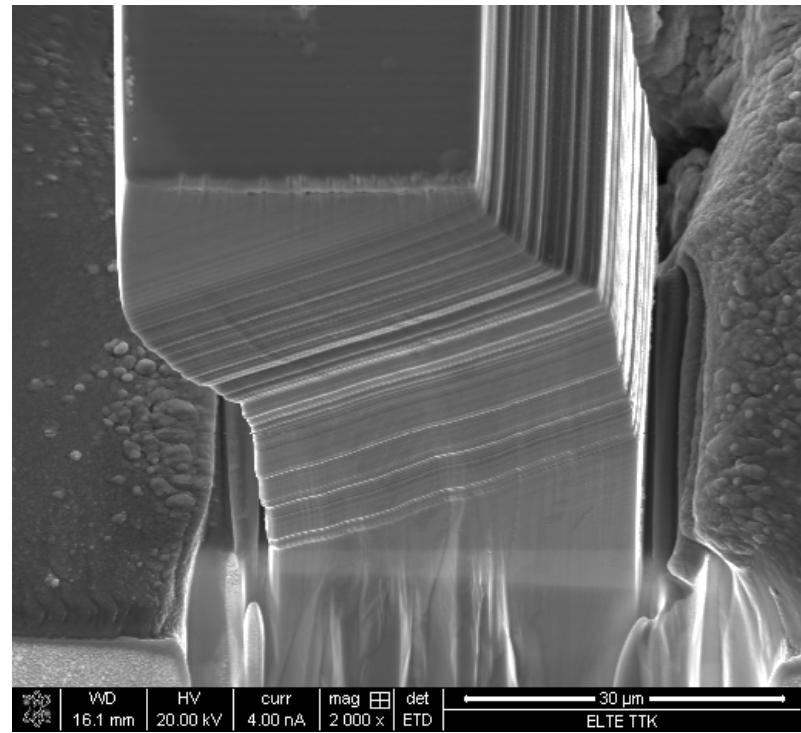
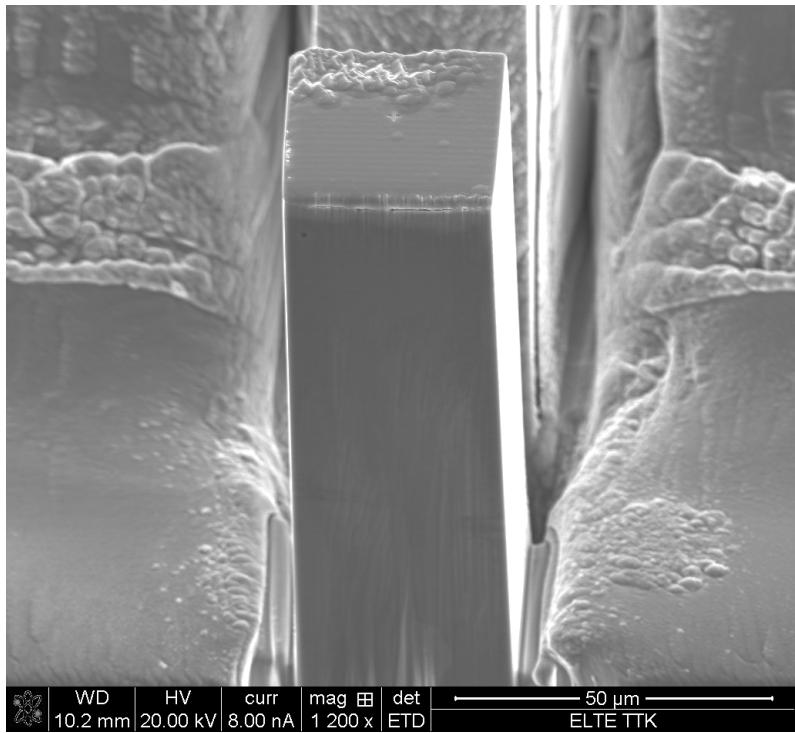
- In situ deformáció a SEM vákuumkamrában
- Precízió
 - xy : 0.5 μm
 - z : 1 nm
 - erő: 1 μN
- Maximum 10 μm elmozdulás z irányban
- Változtatható rugóállandó (jelenleg 1 mN/ μm vagy 10 mN/ μm)
- Mintavétel: 200 Hz



In situ videó: deformáció + AE események

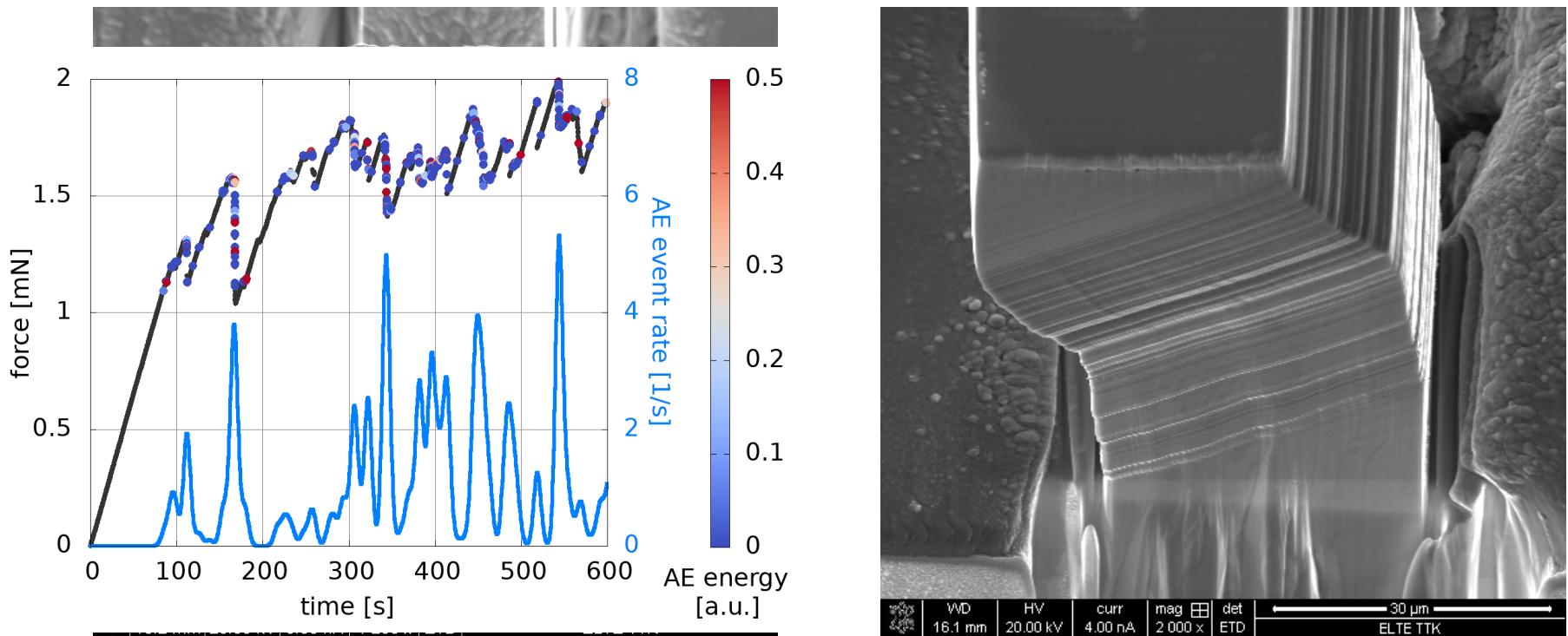


Korreláció a lavinák és az AE jelek között



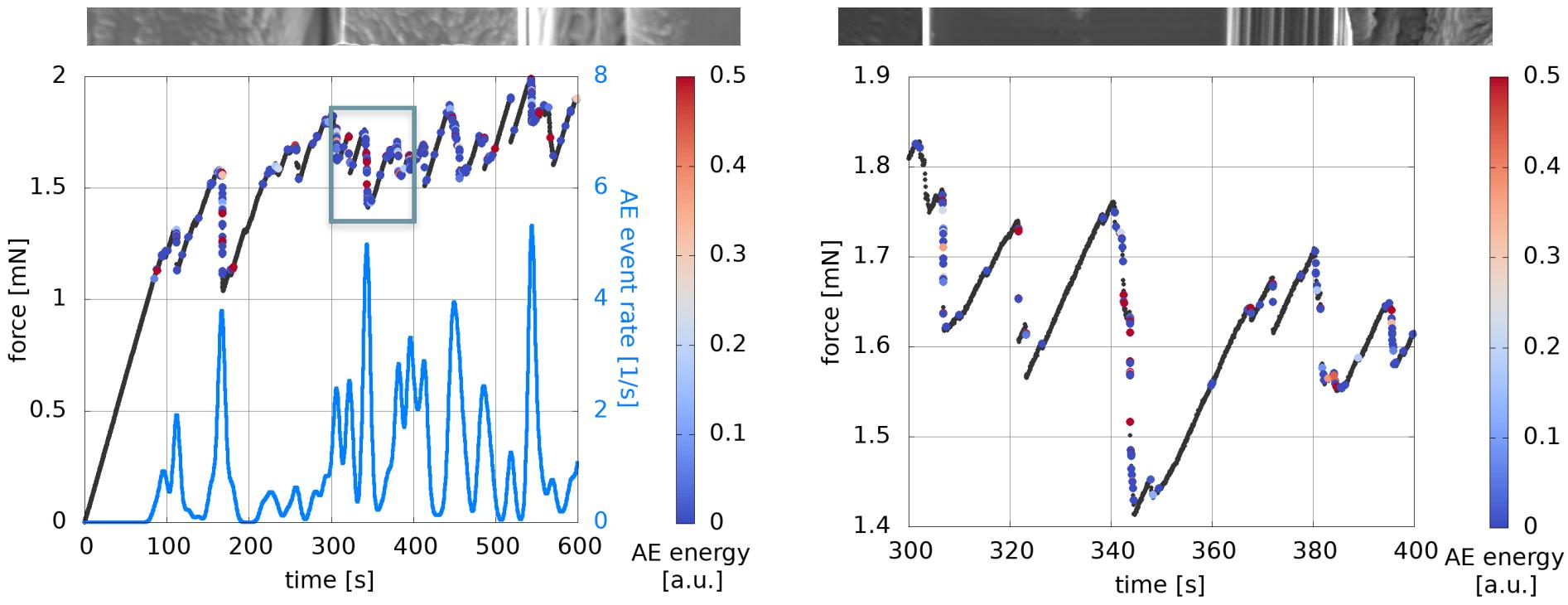
- Csak diszlokációcsúszás figyelhető meg a bazális síkon
- Korreláció a feszültségesések és az AE jelek között
- Számos AE esemény detektálható egy feszültségesés alatt
- ¹⁹Gyakorlatilag nincsenek AE jelek a rugalmas szakaszokban

Korreláció a lavinák és az AE jelek között



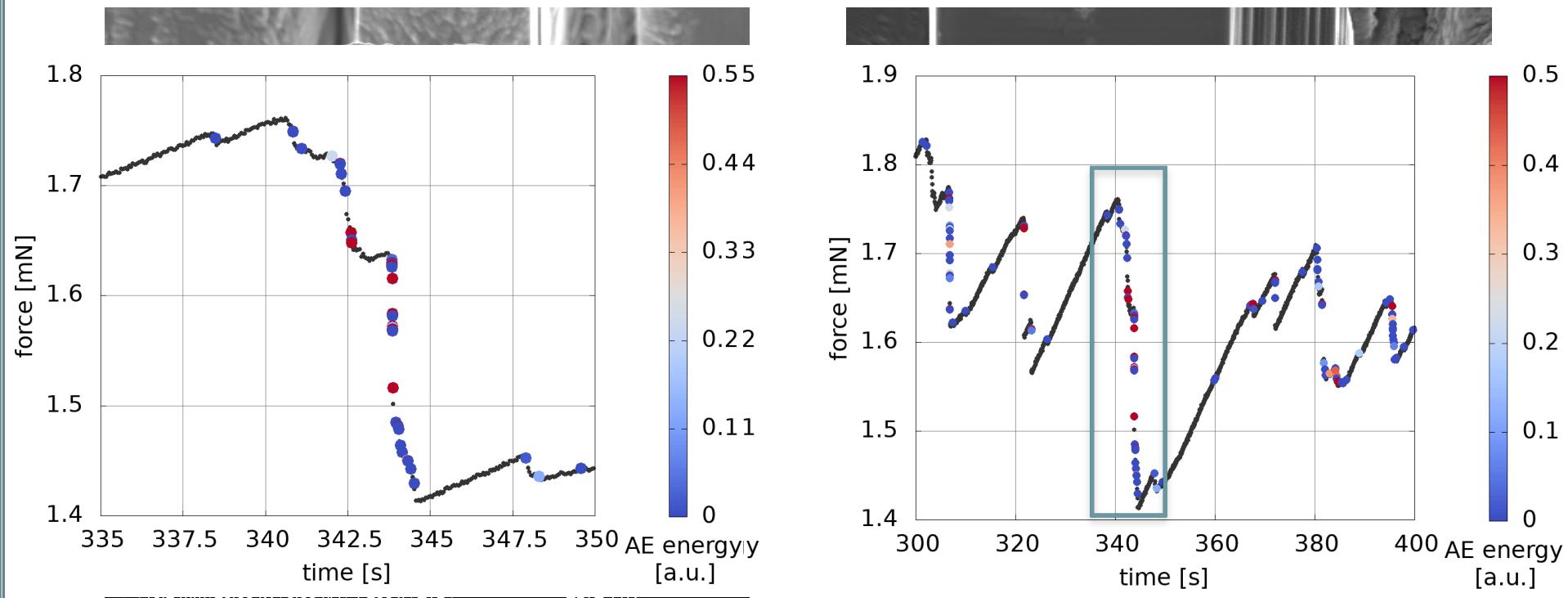
- Csak diszlokációcsúszás figyelhető meg a bazális síkon
- Korreláció a feszültségesések és az AE jelek között
- Számos AE esemény detektálható egy feszültségesés alatt
- ²⁰Gyakorlatilag nincsenek AE jelek a rugalmas szakaszokban

Korreláció a lavinák és az AE jelek között



- Csak diszlokációcsúszás figyelhető meg a bazális síkon
- Korreláció a feszültségesések és az AE jelek között
- Számos AE esemény detektálható egy feszültségesés alatt
- ²¹Gyakorlatilag nincsenek AE jelek a rugalmas szakaszokban

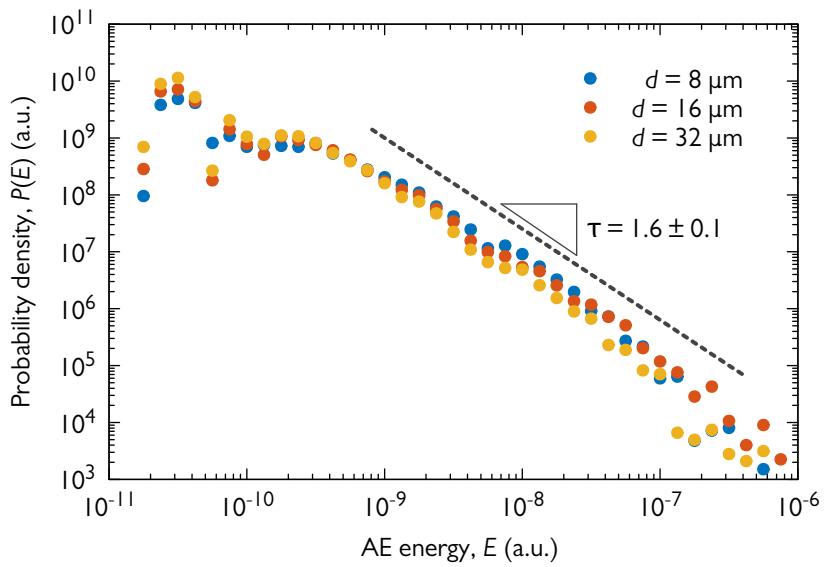
Korreláció a lavinák és az AE jelek között



- Csak diszlokációcsúszás figyelhető meg a bazális síkon
- Korreláció a feszültségesések és az AE jelek között
- Számos AE esemény detektálható egy feszültségesés alatt
- ²²Gyakorlatilag nincsenek AE jelek a rugalmas szakaszokban

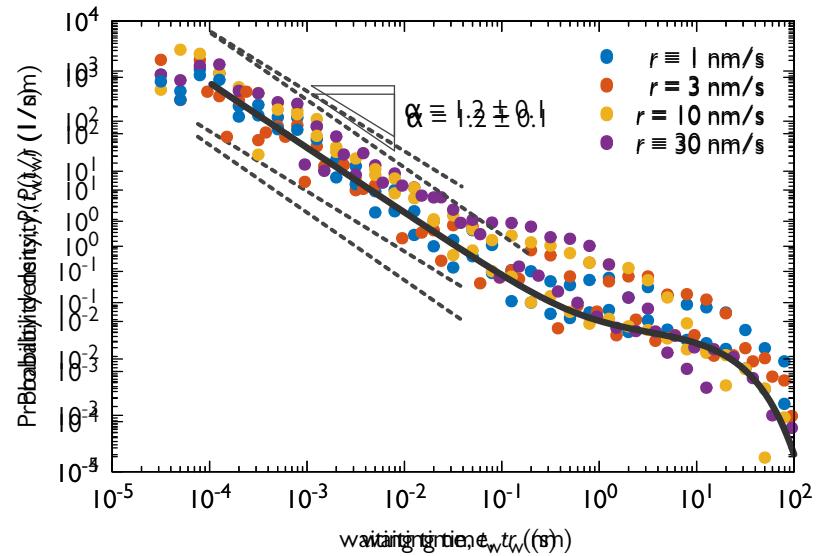
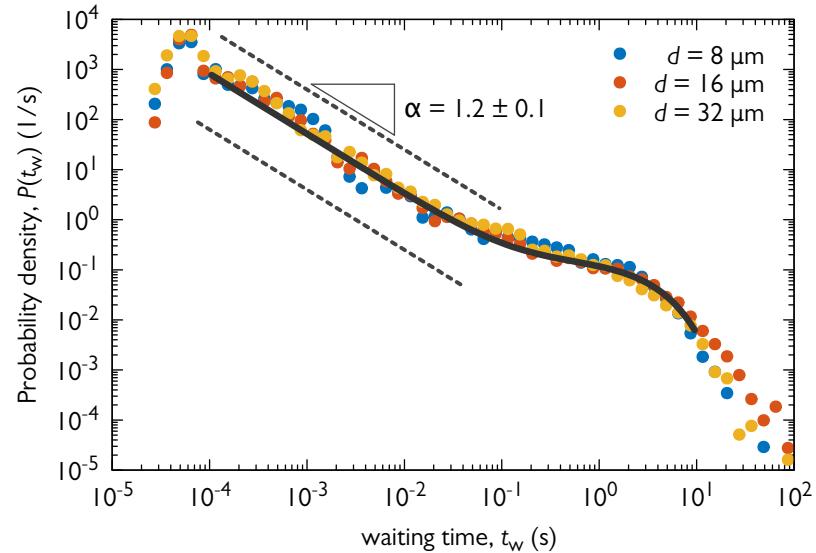
Gutenberg-Richter-törvény

- Az egyedi AE jelek energiájának eloszlása:
 - $P(E) \propto E^{-\tau}$
 - Exponens $\sim 1,6$
- Jó egyezés a tömbi mintákon végzett AE mérésekkel
 - Azonos exponens
 - Rövidebb skálatartomány
- Földrengések esetén
 - $\tau \approx 1,6$



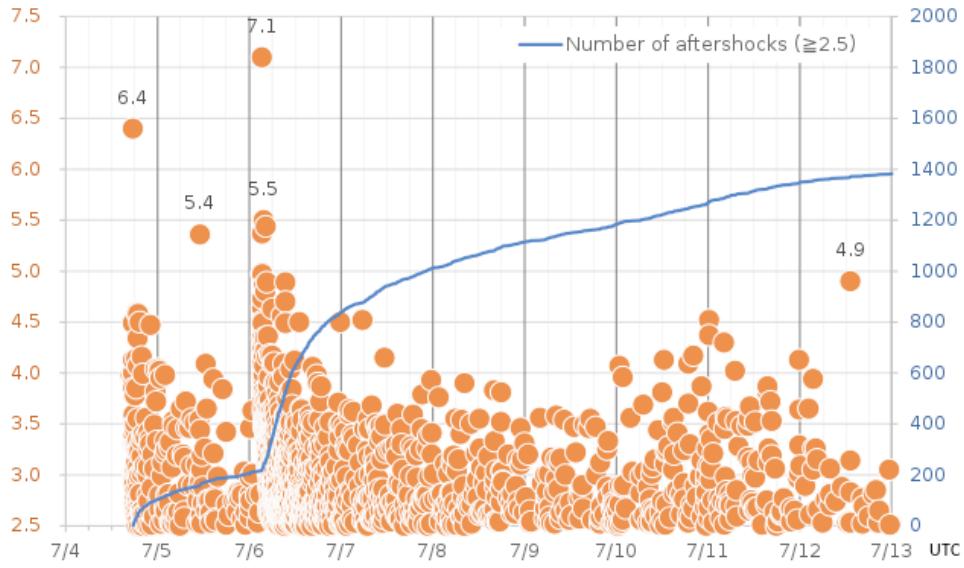
Várakozási idők eloszlása

- Bi-modális eloszlás
 - $P(t_w) = (At_w^{-\alpha} + a) e^{-t_w/t_0}$
 - Közeli jelek: ugyanabból az eseményből
 - Távoli jelek: egymást követő eseményekből
- A lavináknak nincs kitüntetett időskálája, de a véges ráta miatt max. kb. 100 ms-ig tudjuk megfigyelni őket
- Közeli jelek:
 - Skála-független eloszlás
 - Független a deformációs rátától
 - Exponens $\sim 1,2$
- Távoli jelek
 - Exponenciális levágás
 - Függ a deformációs rátától
 - Poisson-szerű

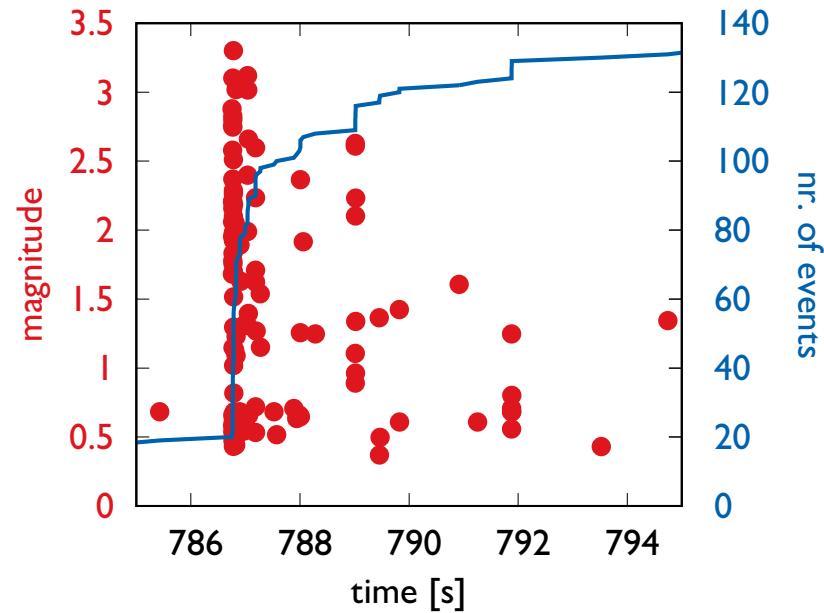


Utórengések

- Egy nagy magnitúdójú jel után számos „utórengés” figyelhető meg
- Legnagyobb jel esetén kb. 120 utórengés
- Az utórengések rátája és átlagos amplitúdója időben csökken



Földrengés



Mikrooszlop

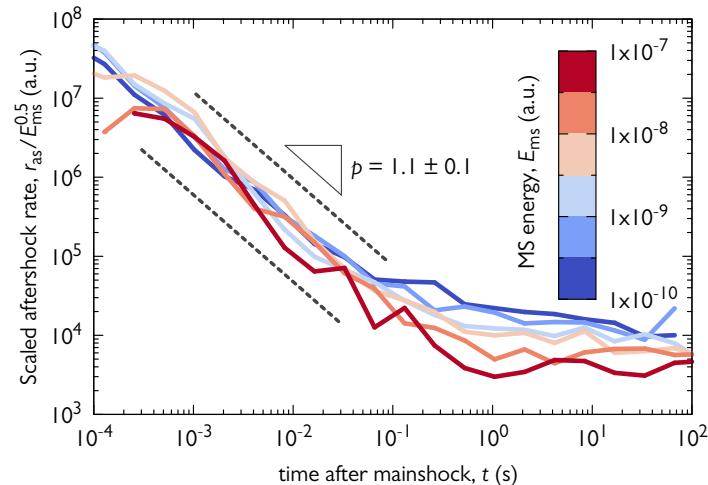
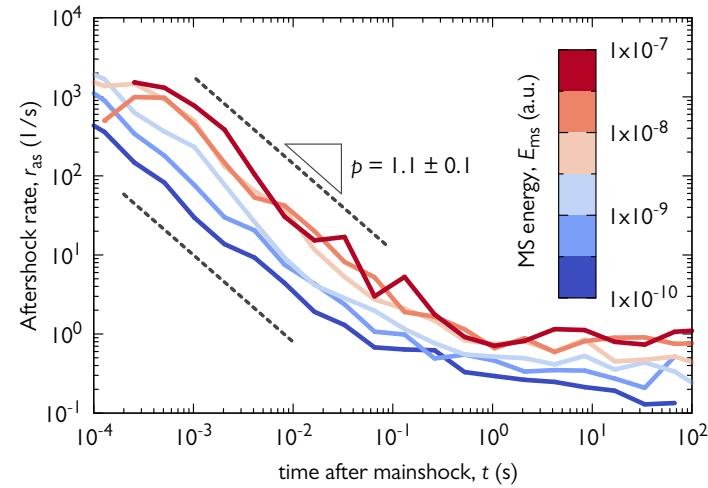
Omori-törvény

- Utórengések rátája

- $n(t) \propto \frac{1}{t^p}$
- Exponens $\sim 1,1$
- Három nagyságrenden át kb. 100 ms-ig
- Hosszabb idők esetén konstans rátá

- Produktivitási tv.

- $n(t) \propto E_{\text{ms}}^\beta$
- Exponens $\sim 0,5$



Földrengések vs. diszlokációtavinák

	Földrengések	Diszlokációtavinák
Mechanizmus	Elcsúszás/repedés	Diszlokációmozgás
Kiterjedés	Síkban	Síkban
Tipikus méret	m	nm
Tipikus kiterjedés	km	μm
Tipikus idő	perc-hónap	ms-s
Méreteloszlás	Gutenberg-Richter	Gutenberg-Richter
Utórengések	Omori-tv. + Produkt. tv.	Omori-tv. + Produkt. tv.

Miért jó ez?

- Elsőként sikerült AE jeleket detektálni mikoronos méretű próbatestek esetén
 - Új in situ mérési eljárás
- Feltártuk az akusztikus emissziós jelek kapcsolatát az őket keltő lokális deformációval
 - Lehetőséget az az akusztikus jelek gyakorlati alkalmazásának továbbfejlesztésére tömbi minták esetén
- Az AE jelek a magas mintavételezés miatt alkalmasak a diszlokációtavinák finomszerkezetének vizsgálatára
 - Elméleti statisztikus fizikai modellek ellenőrzése/kidolgozása
- További tervezek:
 - Bonyolultabb szerkezetű kristályok (ponthibák/besugárzás, fcc)
 - Amorf szerkezetű anyagok

Összefoglalás

- Zn mikrooszlopok *in situ* összenyomása
 - Deformáció diszlokációmozgással
 - Méreteffektusok
 - Lavina-szerű deformáció
- A lavinák során feszültségesek és AE jelek
- Kvalitatív egyezés a földrengésekkel
 - Síkbeli terjedés
 - Skálafüggetlen méreteloszlás
 - Utórengések csökkenő rátával

